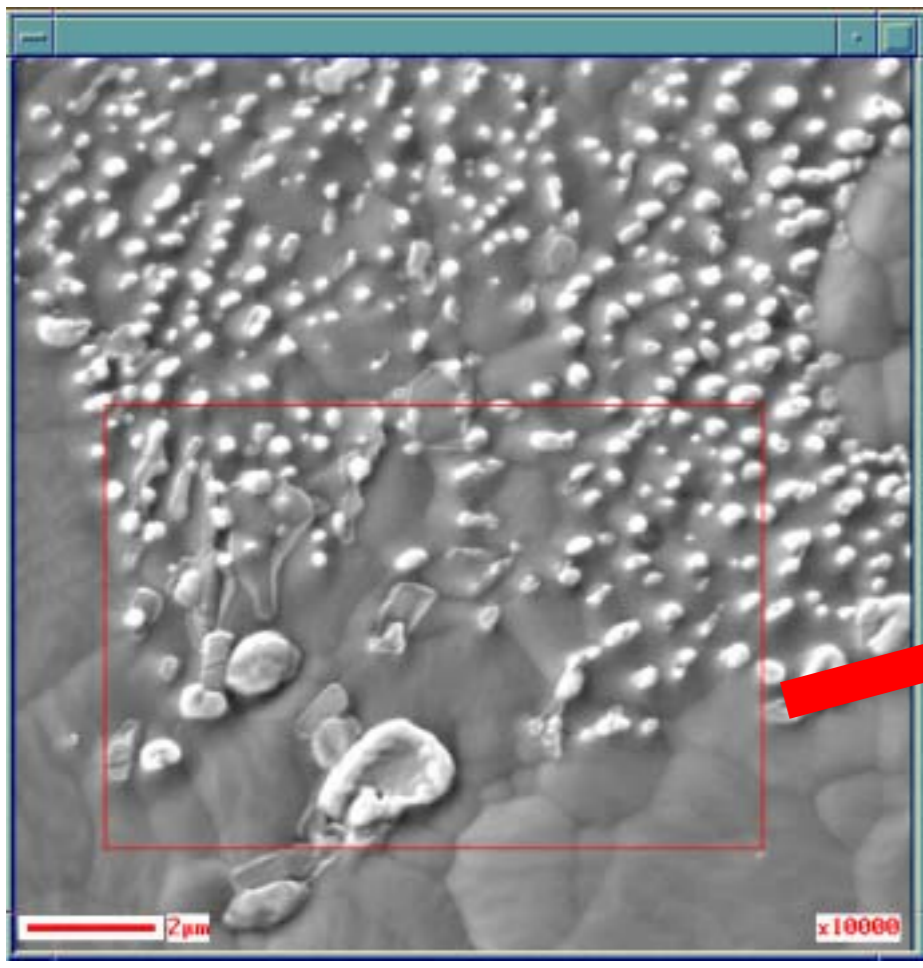


領域指定によるオージェ像収集

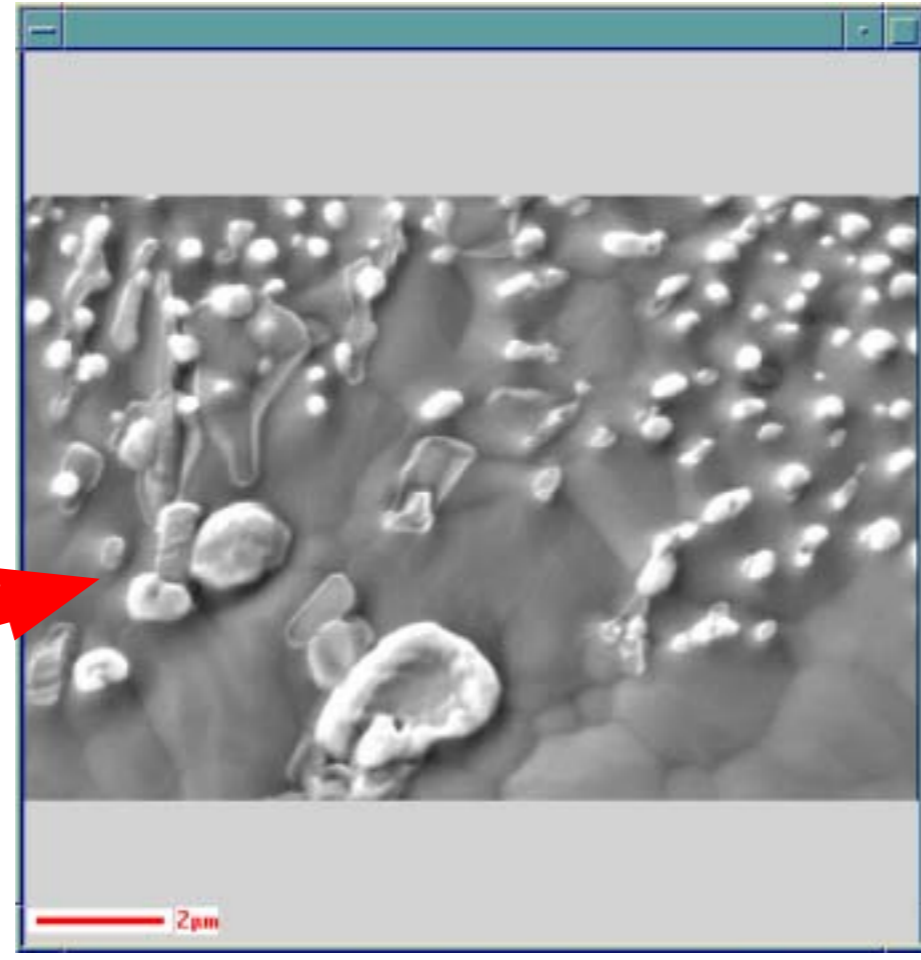
領域指定によるオージェ像収集は、場所と大きさを任意に設定することができ、目的の分析箇所のオージェ像を短時間で測定することができます。また、解像度を上げて精細なオージェ像を測定することもできます。

オージェ像収集中には、分析箇所のドリフトを補正するために、プローブトラッキングを実行しますが、視野全体の画像でドリフトを検出しますので、分析箇所を逃すことはありません。

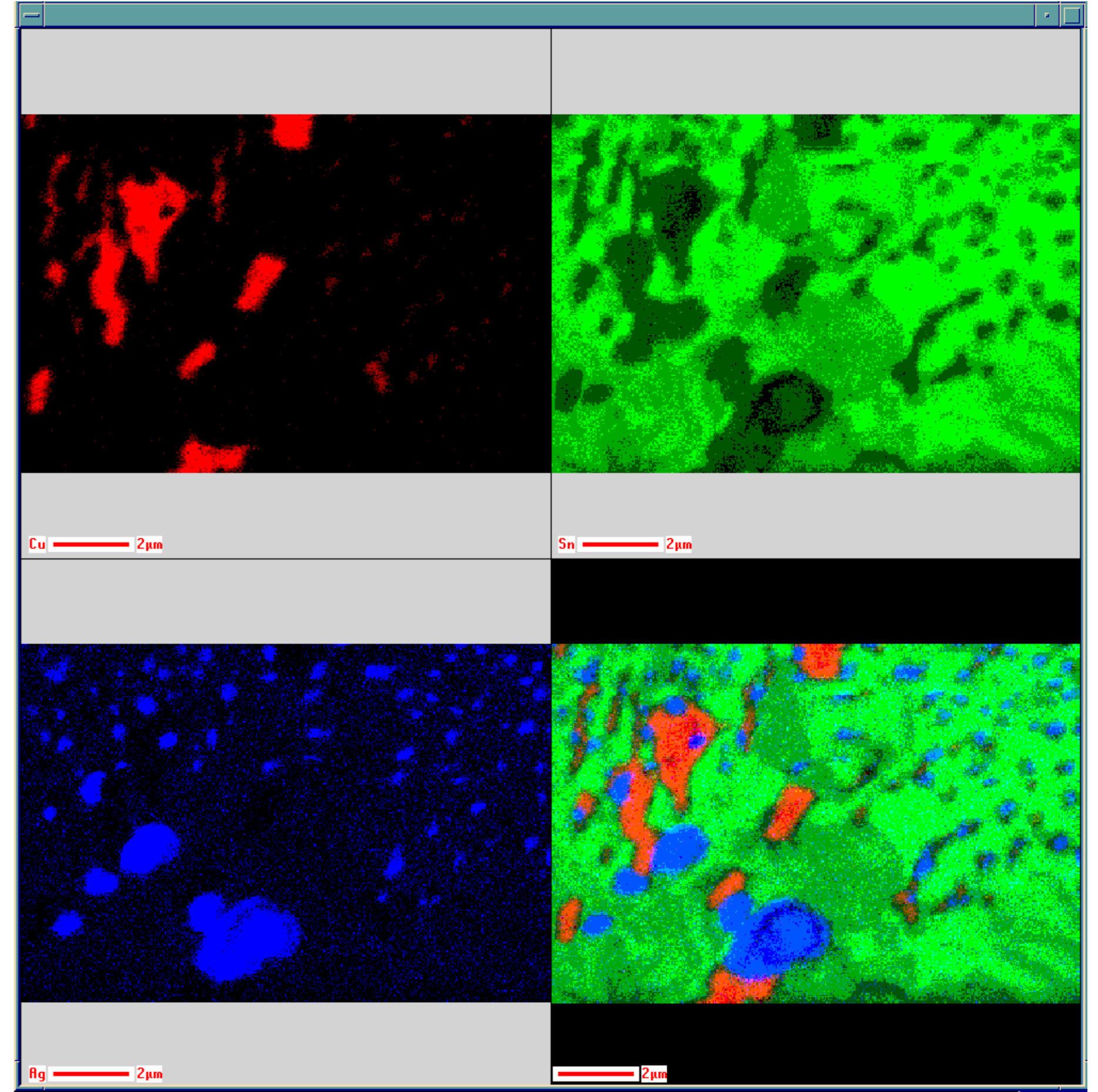
図は、赤枠で囲んだ領域を、解像度を上げて二次電子像とオージェ像を測定した結果です。



二次電子像
(512x512 ピクセル)
試料: 鉛フリー半田

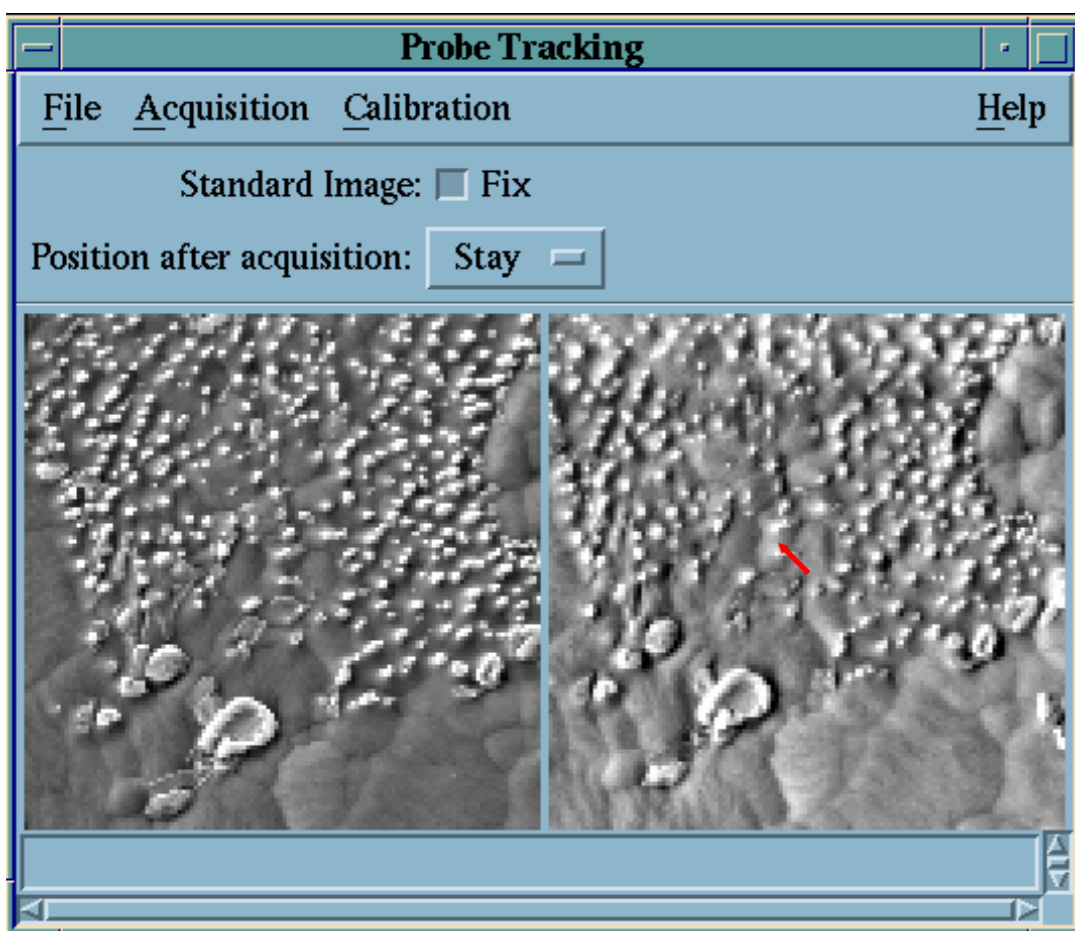


領域指定による二次電子像
(752x510 ピクセル)



領域指定によるオージェ像 (376x255 ピクセル)
左上: Cu 右上: Sn 左下: Ag 右下: RGB合成結果

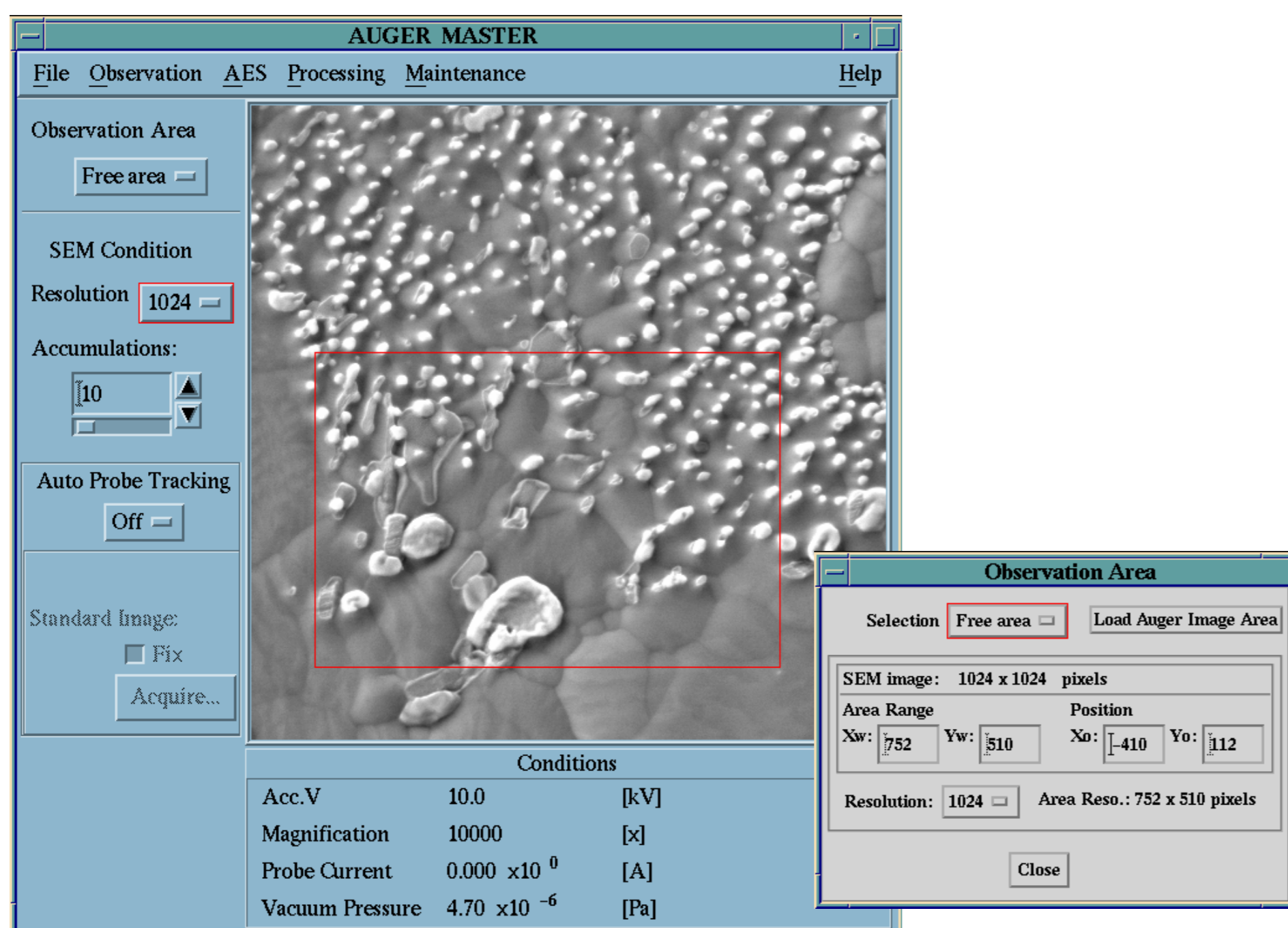
視野全体 (512 x 512 ピクセル) のオージェ像収集に比べて、測定時間が約37%のみに短縮されます。



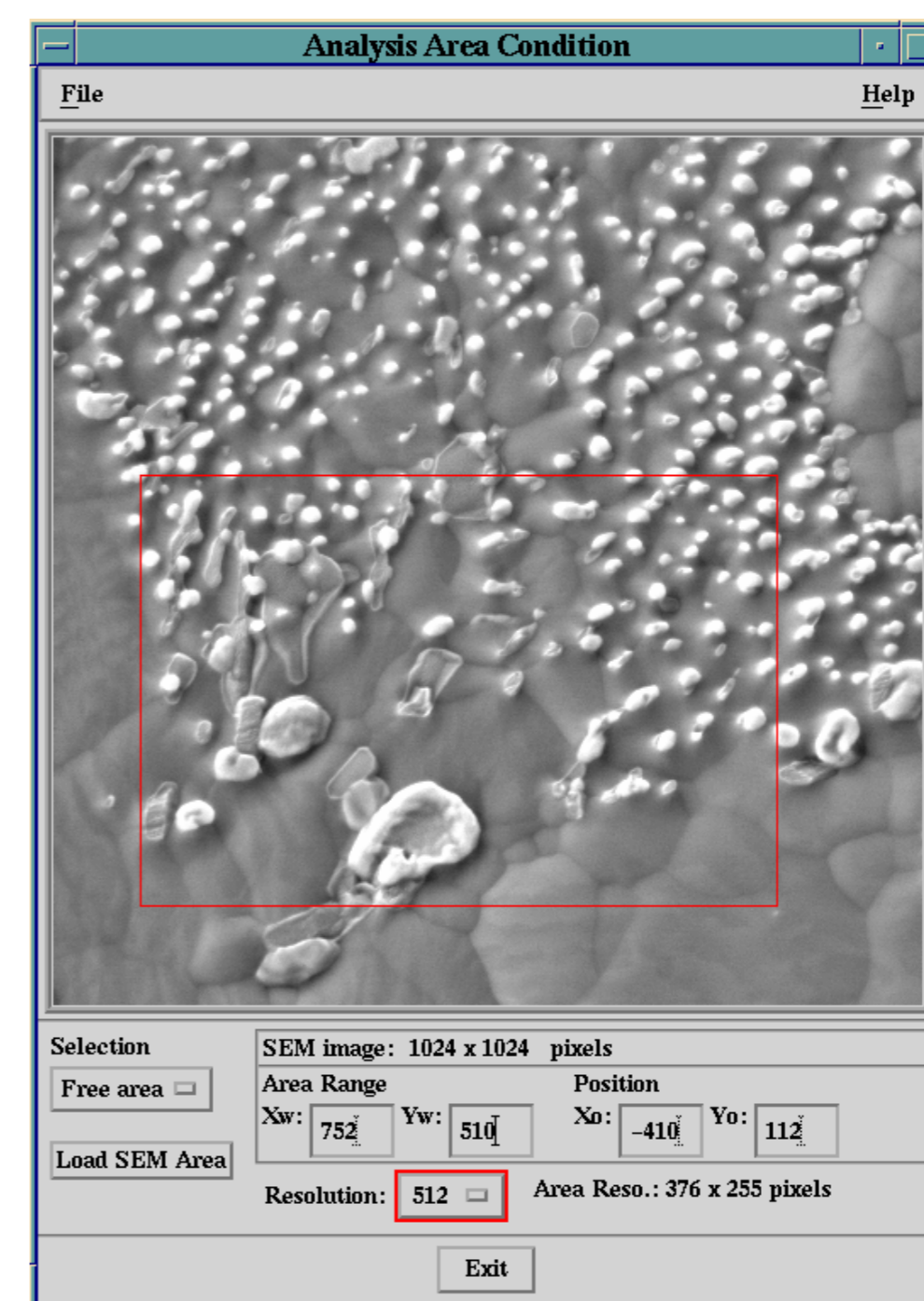
プローブトラッキングの動作

左: 参照画像
右: オージェ像収集中の画像
(矢印の方向ドリフトしているので、イメージシフトで元の視野に戻します)

下図は、二次電子像およびオージェ像の領域設定画面です。それぞれの画面で、同一の視野を指定することができます。



二次電子像の領域設定画面



オージェ像の領域設定画面

AESソフトウェア: Ver.4.01より対応 (OSは HP-UX 10.20以降*)
* HP-UX 9.07 以前の場合は、ワークステーションの更新が必要になります。